

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

младшего научного сотрудника

в лаборатории дифракционных методов исследования реальной структуры кристаллов

Вакансия VAC_PTI_25014

Тематика исследований.

Комплексные исследования структуры и свойств магниевых сплавов и монокристаллов β -полиморфа оксида галлия (β -Ga₂O₃) с использованием рентгеновской дифрактометрии и методов измерения механических характеристик. Подготовка подложек оксида галлия с ненарушенной поверхностью. Изучение дефектов структуры в приготовленных подложках.

Трудовая деятельность.

Непосредственное участие в фундаментальных и прикладных научных исследованиях по заявленной тематике:

1. рентгенодифракционные измерения фазового состава кристаллов β -Ga₂O₃ в зависимости от условий роста;
2. обработка поверхности подложек β -Ga₂O₃ механическими и химическими методами;
3. исследование процессов, приводящих к рассеянию механической энергии в магниевых сплавах или монокристаллах β -Ga₂O₃;
4. освоение новой информации, изложенной на английском и русском языках;
5. представление докладов на российских и международных конференциях;
6. определение возможностей для практического применения полученных результатов.

Конкретные обязанности будут определяться заведующим лабораторией, исходя из квалификации соискателя.

Требования к претенденту.

1. Высшее образование.
2. Стаж научной работы не менее 8 лет.
3. Навыки работы на рентгеновском дифрактометре.
4. Интерес к химико-механическим методам обработки поверхности.
5. Опыт измерения и интерпретации процессов распространения ультразвуковых волн в упругих телах.
6. Наличие публикаций в научных журналах, индексируемых Scopus и входящих в ядро РИНЦ и WoS (не менее 20 за последние 8 лет).
7. Опыт работы в научных коллективах, в том числе в условиях грантовой системы.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 31600 руб.

СТАВКА: 1.0

Срок трудового договора – 5 лет.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.